

テスト技術セミナー（テスト技術動向紹介）のご案内

大分県LSIクラスター形成推進会議 グローバルイノベーション部会では、テスト技術をキーとして、テスト技術の動向を紹介するセミナーを開催いたします。

会員企業の皆さまには、自社の立ち位置の確認や将来の研究開発に向けての指針としてご活用いただければ幸いです。この機会を是非ご活用いただきますようお願いいたします。

参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項を記載の上、メールまたはFAXいただきますようお願い申し上げます。

【日時】平成28年8月5日（金）13:30～17:00

【場所】大分県産業科学技術センター 第1研修室

〒870-1117 大分市高江西1丁目4361-10

TEL 097-596-7100

【概要】

- 13:30 開会挨拶 グローバルイノベーション部会 樋口部会長
13:35-13:40 趣旨説明・講師紹介 大分大学工学部 准教授 大竹哲史 氏
13:40-14:40 【演題1】設計・テスト技術動向概観
【講師】九州工業大学 客員教授 佐藤康夫 氏
半導体のテスト技術を巡る業界や技術の動向について、ITRS（国際半導体技術ロードマップ）やITC（International Test Conference）等の調査から紹介し、今後の進むべき道を考える。
14:40-15:20 【演題2】デジタルDFT 関係
【講師】九州工業大学 客員教授 佐藤康夫 氏
半導体のテスト技術について、ロジックやSOCを中心に技術動向や着目技術を紹介する。
15:20-15:40 休憩
15:40-16:00 【演題3】アナログテスタロードマップ
【講師】株式会社アドバンテスト 石田雅裕 氏
アドバンテストのアナログテスタを紹介し今後必要となる機能等について概説する。
16:00-17:00 【演題4】DUT 電源品質制御技術について
【講師】株式会社アドバンテスト 石田雅裕 氏
デバイステストにおける試験品質を向上するための電源品質制御技術について、最新の研究成果をまじえて紹介する。
17:00 閉会

**※なお、セミナー終了後に大分市内で講師を囲んで交流会を開催いたします。
奮ってご参加ください。（交流会費：4000円程度）**

【申込〆切】7月29日（金）

【受講料】無料

【問い合わせ先／申込先】

大分県LSIクラスター形成推進会議 事務局 秋本、衛藤
（大分県産業科学技術センター内）

〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10

TEL/FAX: 097-596-7179

e-mail: oita-lsi@columbus.or.jp